



Club Commun SFO/SEE
Systèmes Optroniques pour
l'Observation et la Surveillance
(SOOS)



6^{ème} Journée du Club SOOS

« Quelques défis en métrologie pour l'optronique »

Dans le cadre de PRI – PHOTON Recherche Industrie



Paris, Porte de Versailles, au sein du salon OPTO

Mardi 4 octobre 2011

Cette journée est la 6^{ème} journée d'études organisée par le club SOOS, Systèmes Optroniques pour l'Observation et la Surveillance.

L'objectif de ce club est de favoriser les échanges de connaissances scientifiques et techniques entre la recherche et l'industrie en organisant diverses manifestations scientifiques : journées d'études, colloques thématiques.

Programme

9.00-9.30	Accueil		
9.30-10.00	Introduction M Sirieix, JC Fontanella		
	Interférométrie atomique et mesure de précision Noël Dimarcq SYRTE		
10.00-11.20	Session 1 - Métrologie temps distance	Président : Pierre Bourdon	
	Les peignes de fréquences optiques à laser femtosecondes : un pivot pour la métrologie des fréquences optiques	Y. Lecoq	SYRTE
	Asservissement et cophasage des antennes synthétiques dédiées à l'imagerie haute résolution pour l'astronomie	François Reynaud	XLIM
	Mesure de distance au nm pour vol de satellites en formation	Phung Duy Ha	VIRGO/ LISA
	Lasers bifréquence: génération de référence de fréquence ultra stables pour les radars et télémétrie haute résolution pour les lidars	G Pillet et al	THALES TRT
11.20-11.40	Pause Café		
11.40-13.00	Session 2 - Métrologie radiométrique de détecteurs	Président : Riad Haïdar	
	Détecteurs infrarouges : que devra-t-on mesurer demain ?	P. Castelein JC Peyrard	LETI DGA
	Etude des mesures de caractérisation des capteurs bas niveau de lumière	S Minisclou C Vergnenègre	DGA TA
	Caractérisation hyperspectrale de plans focaux IR	Y Ferrec	DOTA
	Nouvelles architectures de ROIC à grande dynamique et réponse logarithmique. Etat de l'art et applications visées.	Yang Ni	NIT
13.00 - 14.30	Déjeuner libre sur le salon		
14.30 - 15.50	Session 4 - Métrologie optique et couches minces optiques	Président : Michel Sirieix	
	Extremely Large Telescope M1 : enjeu et métrologie	Rémi Bourgois, A-L Hamy, P.Plainchamp	SAGEM/RE OSC
	Tenue au flux laser des composants optiques	Mireille Commandré	Institut Fresnel
	Nouveaux domaines de l'analyse de surface d'onde	Jérôme Primot	ONERA
	Capteurs spectrométriques Raman pour le contrôle de matériaux pour l'optoélectronique	D Chapron et al.	LMOPS Metz
15.50-16.10	Pause Café		
16.10 - 17.30	Session 5 - Performances système	Président : Jean-Louis Meyzonnette	
	Performance des caméras IR : limites des critères classiques, vers des critères mêlant résolution spatiale et radiométrique	Alain Kattnig	ONERA
	Métriques pour la caractérisation des traitements d'images pour la détection, la reconnaissance et l'identification de cibles	Damien Diaz	Bertin
	Futurs grands systèmes d'observation spatiaux: Nouveaux besoins de métrologie interne et dispositifs de correction associés	Emmanuel Sein	Astrium
	Détermination précise de l'orientation de la ligne de visée et géolocalisation de la cible dans les systèmes optroniques	Bernard Boehm	Sagem
18.00	Fin de la journée		